



中華民國專利證書

新型第 M616396 號

新型名稱：陣列式反射面形式的天線量測系統

專利權人：周錫增

新型創作人：周錫增、邱志偉、林昭和

專利權期間：自2021年9月1日至2031年4月8日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局局長

洪淑敏

中華民國



110 年 9 月 1 日

